

NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD

CEI  
IEC

60748-11

QC 790100

1990

AMENDEMENT 2  
AMENDMENT 2  
1999-04

---

---

Amendement 2

**Dispositifs à semiconducteurs –  
Circuits intégrés –**

**Onzième partie:  
Spécification intermédiaire pour les circuits  
intégrés à semiconducteurs  
à l'exclusion des circuits hybrides**

[IEC 60748-11:1990/AMD2:1999](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/093be794-3f7a-4fe9-b447-1146d3ea583a/iec-60748-11-1990-amd2-1999)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/093be794-3f7a-4fe9-b447-1146d3ea583a/iec-60748-11-1990-amd2-1999>

Amendment 2

**Semiconductor devices –  
Integrated circuits**

**Part 11:  
Sectional specification for semiconductor  
integrated circuits excluding hybrid circuits**

© IEC 1999 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission  
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembe Geneva, Switzerland  
e-mail: [inmail@iec.ch](mailto:inmail@iec.ch) IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE

C

*Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue*

## AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 47A: Circuits intégrés, du comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs à semiconducteurs.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
47A/536/FDIS	47A/551/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 24 (voir l'amendement 1)

### Tableau II – Groupe A: Contrôles lot par lot

Dans la note 3, ajouter ce qui suit:

«Dans un tel cas, lorsque l'essai duplique celui d'un autre sous-groupe, il n'a pas besoin d'être répété.»

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/093be794-3f7a-4fe9-b447-1146d3ea583a/iec-60748-11-1990-amd2-1999>

Page 26 (voir l'amendement 1)

### Tableau III – Groupe B: Contrôles lot par lot

Supprimer le texte existant de la note 4, qui est ambiguë, et le remplacer par ce qui suit:

«La spécification particulière cadre peut diminuer l'exigence des essais des sous-groupes A3, A3a et A3b à celle d'un seul sous-groupe.»

Page 28 (voir amendement 1)

### Tableau IV – Groupe C: Contrôles périodiques

Dans la colonne «Conditions» pour le sous-groupe C9, supprimer l'indication «Méthode 1» qui n'existe pas et la remplacer par ce qui suit:

«Temps et température à spécifier dans les spécifications intermédiaires et de détail.»

## FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 47A: Integrated circuits, of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
47A/536/FDIS	47A/551/RVD

Full information on the voting of the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

Page 25 (see amendment 1)

### Table II – Group A: Lot-by-lot

*In note 3, add the following:*

"In such a case, where the test ~~duplicates that of another~~ subgroup, this test need not be repeated."

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/093be794-3f7a-4fe9-b447-1146d3ea583a/iec-60748-11-1990-amd2-1999>

Page 27 (see amendment 1)

### Table III – Group B: Lot-by-lot

*Delete the existing wording of note 4, which is ambiguous, and substitute the following:*

"The blank detail specification can reduce the requirement for subgroup testing in A3, A3a and A3b to a minimum of one subgroup."

Page 29 (see amendment 1)

### Table IV – Group C: Periodic tests

*Under "Details and conditions" for subgroup C9, delete "Method 1" which is non-existent, and substitute the following:*

"Time and temperature to be specified either in the sectional or in the detail specification."

**Tableau VII – Exigences de prélèvement pour les essais du Groupe A**

*Remplacer le tableau existant par le nouveau tableau suivant:*

Sous- groupe	NQT (note 10)			NQA					
	Catégorie I	Catégorie II	Catégorie III	Catégorie I		Catégorie II		Catégorie III	
				NC	NQA	NC	NQA	NC	NQA
A1	7	3	3	II	1,0	II	0,4	II	0,4
A2	1	0,7	0,7	II	0,15	II	0,1	II	0,1
A2a	–	3	3	–	–	II	0,4	II	0,4
A2b	–	3	3	–	–	II	0,4	II	0,4
A3	5	2	2	II	0,65	II	0,25	II	0,25
A3a	10	3	3	S4	1,5	S4	0,4	S4	0,4
A3b	20	3	3	S4	2,5	S4	0,4	S4	0,4
A4	10	5	5	S4	1,5	S4	0,65	S4	0,65
A4a	–	7	7	–	–	S4	1,0	S4	1,0
A4b	–	7	7	–	–	S4	1,0	S4	1,0

NOTE 10 – Niveau de qualité toléré, avec un critère d'acceptation maximal de 4.

ITEH STANDARD PREVIEW  
(standards.iteh.ai)

[IEC 60748-11:1990/AMD2:1999](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/093be794-3f7a-4fe9-b447-1146d3ea583a/iec-60748-11-1990-amd2-1999)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/093be794-3f7a-4fe9-b447-1146d3ea583a/iec-60748-11-1990-amd2-1999>

Page 35

**Table VII – Sampling requirements for Group A tests***Replace the existing table by the following new table:*

Sub-group	LTPD (note 10)			AQL					
	Category	Category	Category	Category I		Category II		Category III	
	I	II	III	IL	AQL	IL	AQL	IL	AQL
A1	7	3	3	II	1,0	II	0,4	II	0,4
A2	1	0,7	0,7	II	0,15	II	0,1	II	0,1
A2a	–	3	3	–	–	II	0,4	II	0,4
A2b	–	3	3	–	–	II	0,4	II	0,4
A3	5	2	2	II	0,65	II	0,25	II	0,25
A3a	10	3	3	S4	1,5	S4	0,4	S4	0,4
A3b	20	3	3	S4	2,5	S4	0,4	S4	0,4
A4	10	5	5	S4	1,5	S4	0,65	S4	0,65
A4a	–	7	7	–	–	S4	1,0	S4	1,0
A4b	–	7	7	–	–	S4	1,0	S4	1,0

NOTE 10 – Lot Tolerance Percent Defective, with a maximum acceptance number of 4.

**(standards.iteh.ai)**

[IEC 60748-11:1990/AMD2:1999](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/093be794-3f7a-4fe9-b447-1146d3ea583a/iec-60748-11-1990-amd2-1999)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/093be794-3f7a-4fe9-b447-1146d3ea583a/iec-60748-11-1990-amd2-1999>

# iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[IEC 60748-11:1990/AMD2:1999](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/093be794-3f7a-4fe9-b447-1146d3ea583a/iec-60748-11-1990-amd2-1999)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/093be794-3f7a-4fe9-b447-1146d3ea583a/iec-60748-11-1990-amd2-1999>

ISBN 2-8318-4756-7



9 782831 847566

---

ICS 31.200

---